

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number: 2002-311242 (43)Date of publication of application: 23.10.2002

(51)Int.CI. G02B 5/30 G02B 5/18 G11B 7/125

G11B 7/135

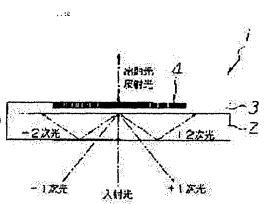
(21)Application number: 2001-119069 (71)Applicant: RICOH CO LTD (22)Date of filing: 18.04.2001 (72)Inventor: SUZUDO TAKESHI

(54) POLARIZED LIGHT SEPARATING ELEMENT, SEMICONDUCTOR LASER UNIT AND OPTICAL PICKUP DEVICE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To stabilize operation by suppressing the generation of stray light.

SOLUTION: In a polarized light separating element 1 provided with an optical anisotropic film 3 formed on an optical isotropic substrate 2 and a diffraction grating 4 having a first cycle structure part formed on the surface of the optical anisotropic film 3 while arraying rectangular ruggedness for a repeating unit along with the surface direction of the optical anisotropic film 3 and a second cycle structure part formed from optically transparent materials while having almost the same diffractive index as a diffractive index in the normal beam direction of the optical anisotropic film or diffractive index in the abnormal beam direction for covering the first cycle structure part so that the end face can form almost the same plane as the surface of the optical anisotropic film 3, the diffractive light of a diffractive angle larger than a prescribed angle in the diffractive light diffracted by the diffractive grating 4 is not emitted outside.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

23.08.2002

[Date of sending the examiner's decision of rejection]
[Kind of final disposal of application other than the

examiner's decision of rejection or application converted registration.

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁(JP)

(12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開2002-311242 (P2002-311242A)

(43) 公開日 平成14年10月23日(2002.10.23)

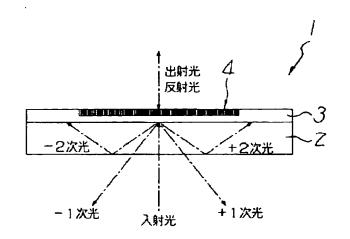
(51) Int. Cl. ⁷	識別記号	FI	テーマコード(参考)	
G 0 2 B	5/30	G O 2 B 5/30	2Н049	
	5/18	5/18	5D119	
G 1 1 B	7/125	G 1 1 B 7/125	С	
	7/135	7/135	Α	
	審査請求 未請求 請求項の数13 () L	(全11頁)	
(21)出願番号	特願2001-119069(P2001-119069)	(71)出願人 000006	747	
		株式会	社リコー	
(22)出願日	平成13年4月18日(2001.4.18)	東京都	東京都大田区中馬込1丁目3番6号	
		(72)発明者 鈴土	岡川	
		東京都	大田区中馬込1丁目3番6号 株式会	
		社リコ	一内	
		(74)代理人 100101	177	
		弁理士	柏木 慎史 (外2名)	
		F ターム(参考) 2H	049 AA03 AA13 AA37 AA45 A A 57	
			AA64 BA05 BA25 BA42 BB44	
			BC12 BC21	
		5D	119 AA04 AA20 AA38 AA40 CA10	
			FAO5 FA25 JA12	

(54) 【発明の名称】偏光分離素子、半導体レーザユニットおよび光ピックアップ装置

(57)【要約】

【課題】 迷光の発生を抑制して動作の安定化を図ることができるようにする。

【解決手段】 光学的等方性基板 2 上に形成された光学的異方性膜 3 と、光学的異方性膜 3 の表面に形成されて光学的異方性膜 3 の面方向に沿って矩形状の凹凸が繰返し単位で配列された第 1 の周期構造部および光学的異方性膜の常光線方向の屈折率または異常光線の方向屈折率と略同一の屈折率を有して光学的に透明な材料によって形成されて、端面が光学的異方性膜 3 の表面と略同一面を形成するように第 1 の周期構造部を覆う第 2 の周期構造部を有する回析格子 4 と、を具備する偏光分離素子 1 で、回析格子 4 により回析された回析光のうち所定角度以上の回析角の回析光を外部に出射させないようにした。



20

30

1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 光学的等方性基板と、

前記光学的等方性基板上に形成された光学的異方性膜 と、

前記光学的異方性膜の表面に形成されて前記光学的異方性膜の面方向に沿って矩形状の凹凸が繰返し単位で配列された第1の周期構造部および前記光学的異方性膜の常光線方向の屈折率または異常光線の方向屈折率と略同一の屈折率を有して光学的に透明な材料によって形成されて、端面が前記光学的異方性膜の表面と略同一面を形成 10 するように前記第1の周期構造部を覆う第2の周期構造部を有する回析格子と、を具備して、

前記回析格子により回析された回析光のうち所定角度以 上の回析角の回析光を外部に出射させないようにした偏 光分離素子。

【請求項2】 前記所定角度は、2次回折光以上の高次の回折光の回析角である請求項1の偏光分離素子。

【請求項3】 前記光学的等方性膜の基板面方向と前記 光学的異方性膜の面方向とを略平行に形成し、入射され る光の波長が â , 前記光学的等方性基板の屈折率が n s , 周囲雰囲気の屈折率が n a である場合の前記回析格 子の前記凹凸の繰返し単位の周期 d が、

 $\lambda (n s / n a) < d < 2 \lambda (n s / n a)$

を満たすようにした請求項1または2記載の偏光分離素子。

【請求項4】 前記光学的等方性膜の基板面方向と前記光学的異方性膜の面方向とを略平行に形成し、入射される光の波長が λ_1 , λ_2 , 前記光学的等方性基板の屈折率が n_3 , 周囲雰囲気の屈折率が n_4 である場合の前記回析格子の前記凹凸の繰返し単位の周期 d_4 が、

 λ_2 (n s/n a) < d < 2 λ_1 (n s/n a), $\lambda_1 < \lambda_2$

を満たすようにした請求項1または2記載の偏光分離素 子。

【請求項5】 前記光学的異方性膜は、前記光学的等方性基板表面に斜め蒸着により蒸着された無機材料によって成膜されている請求項1、2、3または4記載の偏光分離素子。

【請求項6】 前記光学的異方性膜は、使用波長以下の 周期構造を有する請求項1、2、3または4記載の偏光 40 分離素子。

【請求項7】 前記光学的異方性膜は、延伸された有機 材料によって形成されている請求項1、2、3または4 記載の偏光分離素子。

【請求項8】 前記光学的等方性基板は、研磨によって 形成された研磨面より光を入出射する請求項1ないし7 のいずれか一記載の偏光分離素子。

【請求項9】 前記光学的異方性膜に積層された2/4 板を具備する請求項1ないし8のいずれか一記載の偏光分離素子。

【請求項10】 光量をモニタするためのモニタ用受光素子へ向けて半導体レーザから入射された入射光を集光するモニタ光生成機構を具備する請求項1ないし9のいずれか一記載の偏光分離素子。

【請求項11】 実装基板上に実装されてレーザ光を出射する半導体レーザと、

前記半導体レーザから出射されたレーザ光が入射される 請求項1ないし9のいずれか一記載の偏光分離素子と、 前記実装基板上で前記偏光素子からの回析光が照射され る位置に実装された受光素子と、を具備する半導体レー ザユニット。

【請求項12】 実装基板上に実装されてレーザ光を出射する半導体レーザと、

前記半導体レーザから出射されたレーザ光が入射される 請求項10記載の偏光分離素子と、

前記実装基板上で前記偏光素子からの回析光が照射される位置に実装された受光素子と、

前記実装基板上で前記偏光分離素子のモニタ光生成機構 からのモニタ光が照射される位置に実装されたモニタ用 受光素子と、を具備する半導体レーザユニット。

【請求項13】 請求項11または12記載の半導体ユニットと、

前記半導体レーザユニットから出射されたレーザ光を光 記録媒体に照射する対物レンズと、

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、光ディスク用ピックアップ光学系、特に、異なる記録密度を持った媒体に対して、読み取り、及び書き込みを行う光ピックアップ光学系に用いられ、入射する光の偏光状態によってその偏光を分離するための偏光分離素子、偏光分離素子を用いた半導体レーザユニット、および、半導体レーザユニットを用いた光ピックアップ装置に関する。

[0002]

【従来の技術】近年、例えば、CD(Compact Disc)やDVD(Digital VideoまたはVersatileDisc)等、様々な光記録媒体への読み取りや書き込みに対応する光ピックアップ装置が研究開発されている。

【0003】光ピックアップ装置は、レーザ光を出射する光源や、光源から出射されたレーザ光を光記録媒体に照射させる対物レンズ等の光学系、光記録媒体からの反射光を検出する光検出器等を備えている。このような光ピックアップ装置は、レーザ光源から光記録媒体に向かうレーザ光を完全に透過させ、光記録媒体からの反射光に対して回析を起こさせて、レーザ光路の往復によって光を分離する偏光分離素子を備えている。偏光分離素子50は、レーザ光の偏光面状態によって、透過率や回析効率

等の光学特定が異なる回析格子を有する。

【0004】また、光ピックアップ装置は、偏光分離素 子の対物レンズ側に設けられたλ/4板(1/4波長板) を備えている。この1/4板によって、偏光分離素子に は偏光方向が90°回転された反射光が入射される。こ れによって、反射光は、光検出器に導かれる。

【0005】ところで、近年では、例えば、CDとDV Dとのように、異なる記録密度を持つ複数種類の光記録 媒体に対する読み取り/書き込みを、単一の光ピックア ップ装置を用いて行うことを可能とする研究開発が盛ん 10 に行われている。

【0006】異なる記録密度を持つ光記録媒体に対する 読み取り/書き込みを、単一の光ピックアップ装置を用 いて行うためには、単一の光ピックアップ装置内に波長 の異なった2つのレーザ光源を搭載する必要がある。

【0007】異なる記録密度を持つ光記録媒体に対する 読み取り/書き込みを、単一の光ピックアップ装置を用 いて行うためには、例えば、波長の異なる各レーザ光源 に対応させて構成した光学系を単一の光ピックアップ装 置に搭載することでも実現することが可能であるが、波 20 の検出に悪影響が発生するという不具合がある。 長の異なる各レーザ光源に対応させて構成した光学系を 単一の光ピックアップ装置に搭載する場合、光ピックア ップ装置が大型化してしまうことが懸念される。

【0008】この対策として、2つの異なるレーザ光源 を備えるとともに、一つの光学系においてその目的を達 成することができる光ピックアップ装置が開発されてい る。このような光ピックアップ装置の開発に際しては、 様々な部品の共通化が必要になってくる。

【0009】共通化が必要となる部品の一つに、上述し た偏光分離素子がある。このような光ピックアップ装置 に搭載される偏光分離素子には、以下に説明するような ものがある。

【0010】第1の従来例としては、特開平11-311709 号公報に開示されているように、LN基板を用いて、イ オン交換方法によって形成するようにした偏光分離素子 がある。

【0011】第2の従来例としては、特開平11-295510 号公報に開示されているように、ジアセチレンモノマー 膜に対して紫外線を照射することで形成するようにした 偏光分離素子がある。

【0012】第3の従来例としては、特開平11-64615号 公報に開示されているように、ガラス基板上に形成した 高分子液晶膜をドライエッチング方法によってパターン 形成し、屈折率をマッチングさせた充填材を充填するこ とで形成するようにした偏光分離素子がある。

[0013]

【発明が解決しようとする課題】上述したような3つの 従来例では、いずれも、回折格子の狭ピッチ化や形状を 完全矩形にすることを目的に発明されている。

【0014】しかし、実際上、回析格子の形状に関して 50

は、上記の方法によっても完全矩形にすることは困難で あることが懸念される。

【0015】特開平11-31170号公報に開示されている技 術では、イオン交換方法を用いるために、領域の分離が 拡散により支配されるため、完全に分離できないという 不具合がある。

【0016】特開平11-295510号公報に開示されている 技術では、紫外照射においても、完全平行光を用いなけ れば領域の分離が困難であることに加えて、基板からの 反射光や散乱光等によっても条件が狭くなり、全ての凹 凸を理想的に分離することができないという不具合があ

【0017】特開平11-64615号公報に開示されている技 術では、ドライエッチングによっても、サイドエッチン グやマスク後退などの影響で、完全矩形の回折格子を形 成することが困難であるという不具合がある。

【0018】回折格子形状が完全矩形出ない場合には、 設計上発生しない偶数次回折光が発生し、効率が低下す るばかりではなく、不要な光が発生することになり、光

【0019】回析格子の形状が不完全な矩形状である場 合、例えば、読み取り不良、書き込み不良が発生する。

【0020】本発明は、迷光の発生を抑制して動作の安 定化を図ることができる偏光分離素子、半導体レーザユ ニットおよび光ピックアップ装置を得ることを目的とす る。

[0021]

【課題を解決するための手段】請求項1記載の発明の偏 光分離素子は、光学的等方性基板と、前記光学的等方性 基板上に形成された光学的異方性膜と、前記光学的異方 性膜の表面に形成されて前記光学的異方性膜の面方向に 沿って矩形状の凹凸が繰返し単位で配列された第1の周 期構造部および前記光学的異方性膜の常光線方向の屈折 率または異常光線の方向屈折率と略同一の屈折率を有し て光学的に透明な材料によって形成されて、端面が前記 光学的異方性膜の表面と略同一面を形成するように前記 第1の周期構造部を覆う第2の周期構造部を有する回析 格子と、を具備して、前記回析格子により回析された回 析光のうち所定角度以上の回析角の回析光を外部に出射 40 させないようにした。

【0022】したがって、例えば、光ピックアップ装置 へ適用した際に、回析格子における凹凸が不完全な矩形 状であるために不要な回析光が発生した場合にも、回析 格子により回析された回析光のうち所定角度以上の回析 角の回析光は外部に出射されないため、光ピックアップ 装置の光学系内での迷光の発生を抑制することが可能に なる。

【0023】請求項2記載の発明は、請求項1の偏光分 離素子において、前記所定角度は、2次以上の高次回折 光の回析角である。

【0024】したがって、回析格子における凹凸が不完全な矩形状であるために2次以上の高次回折光が発生した場合にも、2次以上の高次回折光が偏光分離素子の外部へ出射されないため、光ピックアップ装置の光学系内での迷光の発生を抑制することが可能になる。

【0025】請求項3記載の発明は、請求項1または2記載の偏光分離素子において、前記光学的等方性膜の基板面方向と前記光学的異方性膜の面方向とを略平行に形成し、入射される光の波長がえ,前記光学的等方性基板の屈折率がns,周囲雰囲気の屈折率がnaである場合の前記回析格子の前記凹凸の繰返し単位の周期dが、え(ns/na)

(ns/na)

【0027】したがって、光学的等方性膜の基板面方向と光学的異方性膜の面方向(すなわち、周期構造の配列方向)とを略平行とし、 λ (ns/na) < d < 2λ (ns/na) を満たすような周期 d を設定することにより、2次以上の高次回折光の角度が全反射角度 θ c より大きくなり、かつ、1次光の回折角度 θ d が全反射角度 θ c より小さくなる。これによって、所定角度として2次以上の高次回折角を有する高次回析光を外部へ出射させない偏光分離素子を実現することが可能になる。

【0028】請求項4記載の発明は、請求項1または2記載の偏光分離素子において、前記光学的等方性膜の基板面方向と前記光学的異方性膜の面方向とを略平行に形 30成し、入射される光の波長が λ_1 , λ_2 , 前記光学的等方性基板の屈折率が n_s , 周囲雰囲気の屈折率が n_a である場合の前記回析格子の前記凹凸の繰返し単位の周期 dが、 λ_2 (n_s / n_a)< d < $2\lambda_1$ (n_s / n_a), λ_1 < λ_2 を満たすようにした。

【0030】したがって、光学的等方性膜の基板面方向 40 と光学的異方性膜の面方向(すなわち、周期構造の配列方向)とを略平行とし、 λ_2 ($n \le / n a$) $< d < 2 \lambda$, $(n \le / n a)$ を満たすような周期 d を設定することにより、2次以上の高次回折光の角度が全反射角度 θ cより大きくなり、かつ、1次光の回折角度 θ dが全反射角度 θ cより小さくなる。これによって、所定角度として2次以上の高次回折角を有する高次回析光を外部へ出射させない偏光分離素子を実現することが可能になる。

【0031】また、 $\sin\theta$ d = m(λ /d)からも明 ニタするためのモニタ用受光素子へ向けて半導体レーザらかなように、回折角度 θ d は波長 λ 1, λ 2の大小に 50 から入射された入射光を集光するモニタ光生成機構を具

依存し、長い波長 λ_2 の光の回折角度 θ dの方が短い波長 λ_1 の光の回折角度 θ dよりも大きいため、波長の異なる2種類のレーザ光 λ_1 , λ_2 を使用する場合には、短い波長 λ_1 によって周期dの上限を限定し、長い波長 λ_2 によって周期dの下限を限定することが可能になる。これによって、単一の偏光分離素子に対して波長の異なる2種類のレーザ光 λ_1 , λ_2 を入射する場合にも、所定角度として2次以上の高次回折角を有する高次回析光を外部へ出射させない偏光分離素子を実現することが可能になる。

【0032】請求項5記載の発明は、請求項1、2、3 または4記載の偏光分離素子において、前記光学的異方 性膜は、前記光学的等方性基板表面に斜め蒸着により蒸 着された無機材料によって成膜されている。

【0033】したがって、光学的等方性基板表面に斜め 蒸着によって無機材料を蒸着することで、光学的な異方 性を有する単結晶を採用する場合と比較して、実用上、 容易かつ安価に、光学的異方性膜を形成することが可能 になる。

20 【0034】請求項6記載の発明は、請求項1、2、3 または4記載の偏光分離素子において、前記光学的異方 性膜は、使用波長以下の周期構造を有する。

【0035】したがって、膜内に使用波長以下の周期構造を持つことで、光学的異方性膜全体に光学的異方性を 持たせることが可能になる。

【0036】請求項7記載の発明は、請求項1、2、3 または4記載の偏光分離素子において、前記光学的異方 性膜は、延伸された有機材料によって形成されている。

【0037】したがって、光学的な異方性を有する単結晶を採用する場合と比較して、実用上、容易かつ安価に、光学的異方性膜を形成することが可能になる。

【0038】請求項8記載の発明は、請求項1ないし7のいずれか一記載の偏光分離素子において、前記光学的等方性基板は、研磨によって形成された研磨面より光を入出射する。

【0039】したがって、光を入出射する面に対してコーティング等の処理を行う場合と比較して、実用上、実用上、容易かつ安価に、光学的等方性基板を得ることが可能になる。

【0040】請求項9記載の発明は、請求項1ないし8 のいずれか一記載の偏光分離素子において、前記光学的 異方性膜に積層された1/4板を具備する。

【0041】したがって、2/4板を光学的異方性膜に 積層することにより、例えば、光ピックアップ装置へ適 用する場合に、部品点数の削減を図ることが可能にな る

【0042】請求項10記載の発明は、請求項1ないし 9のいずれか一記載の偏光分離素子において、光量をモニタするためのモニタ用受光素子へ向けて半導体レーザから入射された入射光を集光するモニタ光生成機構を具 備する。

【0043】したがって、光源から出射された入射光を モニタ用受光素子へ向けて導くことにより、モニタ用受 光素子でモニタされる光量が出射された光の波長に依存 することがない。これによって、APC駆動等の、モニ タ用受光素子に導かれた光の光量に応じて行う光量安定 化のための動作の信頼性の向上を図ることが可能にな る。

【0044】請求項11記載の発明の半導体レーザユニットは、実装基板上に実装されてレーザ光を出射する半 10 導体レーザと、前記半導体レーザから出射されたレーザ光が入射される請求項1ないし9のいずれか一記載の偏光分離素子と、前記実装基板上で前記偏光素子からの回析光が照射される位置に実装された受光素子と、を具備する。

【0045】したがって、半導体レーザの出力安定化を図ることが可能になる。

【0046】請求項12記載の発明の半導体レーザユニットは、実装基板上に実装されてレーザ光を出射する半導体レーザと、前記半導体レーザから出射されたレーザ20光が入射される請求項10記載の偏光分離素子と、前記実装基板上で前記偏光素子からの回析光が照射される位置に実装された受光素子と、前記実装基板上で前記偏光分離素子のモニタ光生成機構からのモニタ光が照射される位置に実装されたモニタ用受光素子と、を具備する。

【0047】したがって、半導体レーザの出力安定化を図るとともに、半導体レーザユニットの小型化を図ることが可能になる。

【0048】請求項13記載の発明の光ピックアップ装置は、請求項11または12記載の半導体ユニットと、前記半導体レーザユニットから出射されたレーザ光を光記録媒体に照射する対物レンズと、前記半導体レーザユニット中の偏光分離素子と前記光記録媒体との間の光路上でレーザ光の偏光面を変換させる1/4板と、を具備する。

【0049】したがって、安定したレーザ光を得るとともに、モニタのために光記録媒体に対するレーザ光の光量の低下防止を図ることが可能になる。

[0050]

【発明の実施の形態】本発明の第1の実施の形態につい*40

 $\lambda (n s / n a) < d < 2 \lambda (n s / n a)$

ただし、 λ:入射光波長

n s: 偏光分離素子の光学的等方性基板屈折率

na: 偏光分離素子の周囲雰囲気の屈折率

【0057】具体的に、本実施の形態の回析格子4は、深さhが約4.88 μ m、周期dが2.0 μ mに設定されている。

【0058】なお、本実施の形態では、回析格子4の凹 は、レーザ光を出射する半導体レーザとしてのレーザ光 凸部5を埋め込む樹脂をアクリル系樹脂6としたが、回 源11を備えている。本実施の形態では、入射光として 析格子4の凹凸部5を埋め込む樹脂はこれに限るもので 50 CD用の波長780nmのレーザ光を出射するレーザ光

*て図1ないし図3を参照して説明する。本実施の形態は、CDに対して利用される光ピックアップに適用される偏光分離素子について例示する。

8

【0051】図1は、本発明の第1の実施の形態の偏光分離素子を示す側面図である。偏光分離素子1は、光学的等方性基板として、厚さ0.5mmのBK7基板2を使用している。本実施の形態のBK7基板の表面は、研磨面とされており、全反射角度は41.5°程度に設定されている。

【0052】BK7基板2の一端面には、光学的異方性膜として、厚さ10μmのTa2O5膜3が設けられている。Ta2O5膜3の表面には、入射された光を回析する回折格子4を有している。回析光子4は、光学的異方性を有しており、常光線屈折率が1.59、異常光線屈折率が1.67に設定されている。本実施の形態のTa2O5膜3は、斜め蒸着によって成膜されている。回折格子4部分における常光線屈折率と異常光線屈折率との屈折率差は0.08である。

【0053】図2は、Ta2O5膜3を拡大して示す側面図である。Ta2O5膜3の表面に形成された回析格子4は、深さ(紙面上下方向)h、周期(紙面左右方向)dに設定された第1の周期構造部としての矩形状の凹凸部5を有している。

【0054】本実施の形態の回折格子4は、エッチングガスとしてCF4ガスを使用して、レジストマスクを用いたドライエッチングを用いて、深さhが4.88μm、周期dが2.0μmになるように形成されている。回折格子4における凹凸部5には、端面がTa2O5膜3の表面と同一面となるように、アクリル系樹脂6が充30填されている。アクリル系樹脂6は、Ta2O5膜3の表面と同一面となるように回折格子4における凹凸部5に充填されているため、凹凸部5と同じ周期に配列されるため、第2の周期構造部を実現する。本実施の形態のアクリル系樹脂6の屈折率は、Ta2O5膜3の常光線屈折率と同等の1.59である。

【0055】回折格子4の凹凸部5の配列方向は、Ta2O5膜3の面方向に対して略平行となるように配列されている。また、周期dは、(1)式を満たす範囲内に設定されている。

[0056]

/na) ···(1)

はなく、Ta2O5膜3の常光線屈折率と略同一な屈折率を有する樹脂であればよい。

【0059】次に、上述した偏光分離素子1を光ピックアップ装置に適用した場合の光学的動作について図3を参照して説明する。図3は、光ピックアップ装置の構成の一部を示す説明図である。光ピックアップ装置10は、レーザ光を出射する半導体レーザとしてのレーザ光源11を備えている。本実施の形態では、入射光としてのアスを特別である。本実施の形態では、入射光としてのアスを特別である。本実施の形態では、入射光としてのアスを特別である。

源11を用いている。レーザ光源11は、実装基板面1 2に実装されている。実装基板面12の偏光分離素子1 による回析角度に応じた位置には、受光素子13が実装 されている。

【0060】特に図示しないが、本実施の形態では、偏 光分離素子1、実装気板面12に実装されたレーザ光源 11、検出器側とを一体化することで、半導体レーザユ ニットLを構成している。

【 O O 6 1 】 レーザ光の出射方向においてレーザ光源 1 1 に対向する位置には、 B K 7 基板 2 をレーザ光源 1 1 10 側に向けるようにして偏光分離素子 1 が配置されている。

【0062】偏光分離素子1のレーザ光源11と反対側には、対物レンズ14が配置されている。偏光分離素子1と対物レンズ14との間には、図示しないλ/4板や図示しないコリメートレンズ等が設けられている。

【0063】このような光ピックアップ装置10では、 偏光分離素子1に対して、レーザ光源11からTa20 5膜3の常光線方向に平行な直線偏光を出射する。レー ザ光源11から出射されたレーザ光は、BK7基板2面 から入射される。

【0064】ここで、回折格子4内にはTa2O5膜3の常光線屈折率と同等な屈折率を有するアクリル系樹脂6が充填されているため、レーザ光は回折格子4の有無に依らず回折を生じずに偏光分離素子1を透過する。

【0065】偏光分離素子1を通過したレーザ光は、 λ / 4板やコリメートレンズ、対物レンズ1 4等の光学系を通過して、図示しないCD板面に到着する。CD板面に到着したレーザ光は、CD板面(の反射層)によって反射されて、再び λ / 4 板やコリメートレンズ、対物レンズ1 4 等を通過した後に、回折格子4 を介して偏光分離素子1 に入射される。

【0066】ここで、偏光分離素子1に再び入射されるレーザ光は、1/4板を往復で2回通過しているため、偏光状態が入射光に対して直交した直線偏光となる。これによって、CD板面から反射されたレーザ光を、Ta2O5膜3の異常光線方向と平行な直線偏光で偏光分離素子1に入射させることができる。Ta2O5膜3の回折格子4部分の屈折率差が0.08であるため、偏光分離素子1に再入射したレーザ光は回折される。

【0067】ところで、理論的に、回折格子の形状が矩形である場合には、偶数次の回折光は発生しない。

【0068】具体的に、本実施の形態では、回折格子の深さhが4.88 μ mに設定されているため、回折格子の凹凸の部分での光路差は $\lambda/2$ となり0次光(偶数次の回折光)は出力されなくなる。0次光が出力されないことにより、選択的に ± 1 次光のみが発生することになる。

【0069】しかしながら、実際には、完全に矩形状の 凹凸部5を有する回折格子4を作製することは困難であ 50

る。例えば、ドライエッチング時のマスクの後退やサイドエッチングなどの影響により、回折格子4の凹凸部5の形状は台形などの形状になってしまうことが懸念される。回折格子4の凹凸部5の形状が矩形からずれた形状になることにより、±2次光(偶数次の回折光)が発生してしまう。回折格子4の凹凸部5の形状のずれにより発生する±2次光(偶数次の回折光)を素子から出射させて

しまうと、光学系内で迷光となり、信号処理などで悪影

10

響が出てしまうことが懸念される。
 【0070】ところで、θ d:回折格子4での回折角度、m:回折次数、θ c:全反射角度とした場合、回折格子4の回折角度 θ d d (2)式で示され、BK7基板2での全反射角度 θ c d (3)式で示される。

[0071]

s i n θ d = m(λ /d) ...(2) s i n θ c = n a/n s ...(3)

【0072】本実施の形態では、回折格子4の凹凸部5の配列方向が、Ta2O5膜3の面方向に対して略平行となるように配列されているとともに、周期dが(1)式を満たす範囲内に設定されているため、(1), (2), (3)式によれば、

 $(na/ns)m/2 < sin \theta d < (na/ns)m$ が導き出される。つまり、(1)式を満たす範囲内に周期 d を設定することにより、2次以上の回折光の角度 θ d が全反射角度 θ c より大きくなり、かつ、1次光の回折角度 θ d が全反射角度 θ c より小さくなる。

【0073】これによって、2次回析光以上の回折光が 偏光分離素子1の外部へ出射されないため、光学系内で の迷光の発生を抑制することができ、信号検出系の動作 の安定化を図ることができる。

【0074】具体的に、本実施の形態では、周期dが 2.0μ mとされているため、 ± 1 次光は約 23.0° の 角度に回折され、 ± 2 次光は約 51.3° の角度に回折される。一方、BK7 基板2 の全反射角度は 41.5° 程度なので、BK7 基板2 面における ± 2 次光は、図1に示すように、全反射を起こして偏光分離素子1 の外へ出射されなくなる。

【0075】これによって、実用上確実に、光学系内での迷光の発生を防止して、受光素子13で受光したレー40 ザ光に基づいて各種処理を行う信号処理系等の動作の安定化を図ることができる。

【0076】なお、本実施の形態では、BK7基板2の表面が研磨面とされているため、BK7基板2の表面に格別なコーティングをかけることがないため、偏光分離素子1の低コスト化を図ることができる。

【0077】また、Ta2O5膜3は斜め蒸着によって 製膜されているため、Ta2O5膜3内には柱状の波長 以下の図示しない微細構造が形成されている。Ta2O 5膜3を斜め蒸着によって製膜することにより、微細構 造を容易に形成することができる。これにより、通常の 光学的な異方性を持つ単結晶を採用した異方性膜より安 価に、かつ量産に際しての性能のバラツキのない安定し た異方性膜を有する偏光分離素子1を作製することがで

【0078】次に、本発明の第2の実施の形態について 図4および図5を参照して説明する。第1の実施の形態 と同一部分は同一符号で示し、説明も省略する。

【0079】図4は、本発明の第2の実施の形態の偏光 分離素子を示す側面図である。本実施例の形態の偏光分 離素子20は、光学的等方性基板として膜厚0.5mm のBK7基板2を使用している。BK7基板2の全反射 角度は、41.5°程度に設定されている。

【0080】BK7基板2の一端面には、光学的異方性 膜として膜厚50μmに延伸したポリエステル膜21が 積層されている。ポリエステル膜21は、紫外線硬化樹 脂を用いてBK7基板2上に接着されている。ポリエス テル膜21は、常光線方向の屈折率が1.58、異常光 線方向の屈折率が1.69とされている。ポリエステル 膜21における常光線方向の屈折率と異常光線方向の屈 折率との屈折率の差は0.11である。 * 20

*【0081】ポリエステル膜21の表面には、深さh、 周期dに設定された矩形状の凹凸部を有する回折格子2 2, 23が形成されている。回折格子22は偏光を分離 する機能を果たし、回折格子23は入射光の光量をモニ タする機能を果たす。

12

【0082】本実施の形態の回折格子22,23におけ る凹凸部は、エッチングガスとして酸素ガスを使用し て、金属マスクを用いたドライエッチングによって形成 されている。回折格子22,23における凹凸部は、ポ リエステル膜21と略同等の常光線方向の屈折率を有し て、回折格子22,23内の凹凸部を完全に埋め込む様 にして充填された屈折率1.59のアクリル系樹脂6に よってコートされている。

【0083】回折格子22,23の凹凸部の配列方向 は、ポリエステル膜21の面方向(図4中紙面左右方向) に対して略平行となるように配列されている。また、凹 凸部の周期 d は、(4)式、(5)式を満たす範囲内に設定 されている。

[0084]

$$\lambda_2 (n s/n a) < d < 2 \lambda_1 (n s/n a)$$
 ...(4)
 $\lambda_1 < \lambda_2$...(5)

ただし、λ1,λ2:入射光波長

n s: 偏光分離素子の光学的等方性基板屈折率

na: 偏光分離素子の周囲雰囲気の屈折率

【0085】本実施の形態では、具体的に、回折格子2 2, 23の凹凸部の深さhが約3.4μm、周期dが1. 8 μ mに設定されている。また、本実施の形態では、具 体的に、 $\lambda_1 = 650$ nm, $\lambda_2 = 780$ nmである。

形成された λ / 4 板 2 4 が紫外線硬化樹脂によって貼り 付けられている。 λ / 4板24のポリエステル膜21と 反対側の表面には、Crで形成された反射膜25が形成 されている。反射膜25は回折格子23と上下方向にお いて重複するように形成されている。ここに、回折格子 23, 反射膜25等によってモニタ光生成機構26が実 現されている。

【0087】次に、偏光分離素子20を光ピックアップ 装置に適用した場合の光学的動作について図5を参照し て説明する。図5は、光ピックアップ装置の構成の一部 40 を示す説明図である。本実施の形態の光ピックアップ装 置30は、入射光として、CD用としての波長780n mのレーザ光を出射する半導体レーザとしてのレーザ光 源11と、DVD用としての波長650nmのレーザ光 を出射する半導体レーザとしてのレーザ光源31との2 種類のレーザ光源を備えている。2種類のレーザ光源1 1,31は、単一の受光素子13とともに、実装基板面 12に実装されている。

【0088】本実施の形態では、偏光分離素子20、実 装基板面12に実装されたレーザ光源11,31、図示 50 め、回折格子22に入射する際の偏光状態は入射光に対

しない検出器とを一体化することによって半導体レーザ ユニットし'を構成している。

【0089】実装基板面12には、モニタ用受光素子3 2が実装されている。モニタ用受光素子32は、APC (Auto Power Control)駆動を行うために、レーザ光源 1 1,31から出射されるレーザ光をモニタする。APC 駆動は、レーザ光源から出射されるレーザ光の安定化を 【0086】ポリエステル膜21には、ポリエチレンで 30 行うために行う。レーザ光源11,31から出射される レーザ光が安定することにより、光ピックアップ装置3 0の動作の安定化を図ることができる。

> 【0090】光ピックアップ装置30では、偏光分離素 子20に対して、ポリエステル膜21の常光線方向に平 行な直線偏光をBK7基板2面側から入射させる。

> 【0091】ここで、回折格子22内に常光線屈折率と 略同一な屈折率を有するアクリル系樹脂6が充填されて いるため、レーザ光は回折を発生せずに偏光分離素子2 0を透過する。

【0092】偏光分離素子20を通過したレーザ光は、 λ/4板24, コリメートレンズ(図示せず), 対物レン ズ14等の光学系を通過し、図示しないCD板面または 図示しないDVD板面に到着する、CD板面またはDV D板面に到着したレーザ光は、CD板面またはDVD板 面(の反射層)によって反射されて、再び光学系を通過し た後、 礼/4板24側から偏光分離素子20に入射す る。

【0093】ここで、レーザ光は、偏光分離素子20に 一体的に形成されたλ/4板24を2回通過しているた

して直交した直線偏光とされ、ポリエステル膜21の異 常光線方向と平行な直線偏光で回折格子に入射する。

【0094】本実施の形態では、回折格子22部分が屈 折率差0.11に設定されているため、レーザ光は回折 格子22部分で回折される。

【0095】ここで、回折格子22の凹凸部の形状が完 全な矩形である場合には、偶数次の回折光は発生しな い。また、本実施の形態では、回析格子22の凹凸部の 深さ h が 3.4 μ m に 設定されているため、 回折格子 2 2の凹凸の部分での光路差が2種類の波長がともに、ほ 10 \mathbb{F}_{λ} / 2 となる。このため、0 次光もほぼ出力されなく なる。これによって、理想的には、選択的に±1次光の みを発生させることができる。

【0096】しかしながら、実際上は、ドライエッチン グ時のマスクの後退やサイドエッチングなどの影響で、 完全に矩形状の凹凸部を有する回折格子22を作製する ことは困難である。このため、回折格子22の凹凸部の 形状は矩形状からずれた形状となっていることが懸念さ れ、±2次光も発生してしまうことが懸念される。発生 した±2次光が偏光分離素子20から出射されると、光 20 安価かつ性能の安定した偏光分離素子20を得ることが 学系内で迷光となり、信号処理等で悪影響を発生させる ことが懸念される。

【0097】ところで、θd:回折格子22での回折角 度、m:回折次数、θ c:全反射角度とした場合、回折 格子22の回折角度 θ dは(2)式で示され、基板での全 反射角度 θ c は(3)式で示される。

[0098]

s i n θ d = m(λ / d) \cdots (2)

 $sin\theta c = na/ns$ \cdots (3)

【0099】また、本実施の形態では、回折格子22の 凹凸部の配列方向が、ポリエステル膜21の面方向に対 して略平行となるように配列されており、周期 d が (4) 式を満たす範囲内に設定されているため、(2), (3), (4)式によれば、第1の実施の形態で説明したように、 2次以上の回折光の角度 θ d が全反射角度 θ c より大き くなり、かつ、1次光の回折角度 θ dが全反射角度 θ c より小さくなる。

【0100】これによって、2次回析光以上の回折光が 偏光分離素子20の外部へ出射されないため、光学系内 での迷光の発生を抑制することができ、信号検出系の動 40 作の安定化を図ることができる。

【0101】また、(4)式からも明らかなように、回折 角度 θ dは波長 λ 1, λ 2の大小に依存する。長い波長 λ_{2} (= 7 8 0 n m) の光の回折角度 θ d の方が短い波長 λ_1 (=650 n m)の光の回折角度 θ dよりも大きいた め、波長の異なる2種類のレーザ光 λ 1, λ 2を使用す る場合には、短い波長ん」によって周期dの上限を限定 し、長い波長ん2によって周期dの下限を限定すること が可能になる。これによって、単一の偏光分離素子20 に対して波長の異なる2種類のレーザ光 λ 1, λ 2 を入 50 作の安定化を図ることができる。

射する場合にも、所定角度として2次以上の高次回折角 を有する高次回析光を外部へ出射させない偏光分離素子 20を実現することが可能になる。

14

【0102】本実施の形態では、具体的に、波長780 nmレーザ光の±1次光は約25.7°の角度に回折さ れ、±2次光は約60.1°の角度に回折される。ま た、波長650nmレーザ光の±1次光は約21.2° の角度に回折され、±2次光は約46.2°の角度に回 折される。

【0103】一方、BK7基板2の全反射角度は41. 5°程度なので、両波長レーザ光が、±2次光がBK7 基板2面で図3に示すように全反射を起こし、偏光分離 素子20外へ出射されなくなり、迷光が発生しなくな る。これによって信号処理系等の動作の安定化を図るこ とができる。

【0104】さらに、本実施の形態では、光学的異方性 膜にポリエステル製の延伸有機膜であるポリエステル膜 21を使用しているため、通常の光学的な異方性を持つ 単結晶を採用した光学的異方性膜を用いた場合よりも、

【0105】加えて、1/4板24が偏光分離素子20 に対して一体的に形成されているため、光学系の部品点 数の削減を図ることができる。これによって、光ピック アップ装置30における組み立て工程の削減、低コスト 化を図ることができる。

【0106】ところで、偏光分離素子20の回折格子2 2を通過するレーザ光よりも外側に広がって出射された レーザ光の一部は、回折格子23に入射される。回折格 子23に入射したレーザ光は、モニタ光とされ反射膜2 5の反射面25aで反射されて、再び回折格子23に入 射された後、偏光されてモニタ用受光素子32に入射さ れる。モニタ用受光素子32がモニタしたモニタ光は、 レーザ光源11,31から出射されるレーザ光の安定化 を行うためのAPC駆動に利用される。

【0107】レーザ光源11,31から出射された光を モニタ用受光素子32へ向けて導くことにより、モニタ 用受光素子32でモニタされる光量が、出射された光の 波長に依存することがない。これによって、APC駆動 等の、モニタ用受光素子32に導かれた光の光量に応じ て行う光量安定化のための動作の信頼性の向上を図るこ とができる。

【0108】また、本実施の形態では、CD板またはD VD板に向かう本来のレーザ光の有効径よりも外側に位 置するレーザ光をモニタ光として使用している。このた め、本来のレーザ光の光量低下を懸念することなく、確 実にモニタすることができる。

【0109】これによって、レーザ光源から出射される レーザ光の安定化を図り、光ピックアップ装置30の動 【0110】また、モニタ光を集光するモニタ光生成機構26を、偏光分離素子20に一体的に形成することで、光ピックアップ装置30および光ピックアップ装置30を備えるシステム全体における動作の安定化を図ることができる。

$\{01111\}$

【発明の効果】請求項1記載の発明の偏光分離素子によ れば、光学的等方性基板と、前記光学的等方性基板上に 形成された光学的異方性膜と、前記光学的異方性膜の表 面に形成されて前記光学的異方性膜の面方向に沿って矩 10 形状の凹凸が繰返し単位で配列された第1の周期構造部 および前記光学的異方性膜の常光線方向の屈折率または 異常光線の方向屈折率と略同一の屈折率を有して光学的 に透明な材料によって形成されて、端面が前記光学的異 方性膜の表面と略同一面を形成するように前記第1の周 期構造部を覆う第2の周期構造部を有する回析格子と、 を具備して、前記回析格子により回析された回析光のう ち所定角度以上の回析角の回析光を外部に出射させない ようにすることで、例えば、光ピックアップ装置へ適用 した際に、回析格子における凹凸が不完全な矩形状であ 20 るために不要な回析光が発生した場合にも、回析格子に より回析された回析光のうち所定角度以上の回析角の回 析光は外部に出射されないため、光ピックアップ装置の 光学系内での迷光の発生を抑制して動作の安定化を図る ことができる。

【0112】請求項2記載の発明によれば、請求項1の 偏光分離素子において、前記所定角度を2次以上の高次 回折光の回析角とすることで、回析格子における凹凸が 不完全な矩形状であるために2次以上の高次回折光が発 生した場合にも、2次以上の高次回折光が偏光分離素子 の外部へ出射されないため、光ピックアップ装置の光学 系内での迷光の発生を抑制して動作の安定化を図ること ができる。

【0113】請求項3記載の発明によれば、請求項1ま たは2記載の偏光分離素子において、前記光学的等方性 膜の基板面方向と前記光学的異方性膜の面方向とを略平 行に形成し、入射される光の波長がλ,前記光学的等方 性基板の屈折率が n s , 周囲雰囲気の屈折率が n a であ る場合の前記回析格子の前記凹凸の繰返し単位の周期d が、 $\lambda(ns/na) < d < 2\lambda(ns/na)$ を満たすよ うにすることで、回折格子での回折角度が θ d、回折次 数がm、全反射角度が θ c である場合に、s i n θ d = $m(\lambda/d)$ で示される回折格子の回折角度 θ d と、 s i $n \theta c = n a / n s$ で示される基板での全反射角度 θ c。とに対して、2次以上の高次回折光の角度を全反射 角度 θ cより大きくし、かつ、1次光の回折角度 θ dが 全反射角度 θ c より小さくして、所定角度として 2 次以 上の高次回折角を有する高次回析光を外部へ出射させな い偏光分離素子を実現することができる。

【0114】請求項4記載の発明によれば、請求項1ま 50

たは2記載の偏光分離素子において、前記光学的等方性 膜の基板面方向と前記光学的異方性膜の面方向とを略平 行に形成し、入射される光の波長が 1, 12, 前記光 学的等方性基板の屈折率が n s , 周囲雰囲気の屈折率が n a である場合の前記回析格子の前記凹凸の繰返し単位 の周期dが、 λ_2 (ns/na)<d<2 λ_1 (ns/n a), $\lambda_1 < \lambda_2$ を満たすようにすることで、回折格子 での回折角度がθ d、回折次数がm、全反射角度がθ c である場合に、 $sin\theta d=m(\lambda/d)$ で示される回折 格子の回折角度 θ d と、s i n θ c = n a / n s で示さ れる基板での全反射角度 θ c。とに対して、2次以上の 高次回折光の角度が全反射角度 θ c より大きくし、か つ、1次光の回折角度 θ d が全反射角度 θ c より小さく して、所定角度として2次以上の高次回折角を有する高 次回析光を外部へ出射させない偏光分離素子を実現する ことができる。

16

【0115】また、 $sin\thetad=m(\lambda/d)$ からも明らかなように、回折角度 θ d d i 被長 λ 1 , λ 2 の大小に依存し、長い波長 λ 2 の光の回折角度 θ d の方が短い波長 λ 1 の光の回折角度 θ d よりも大きいため、波長の異なる2種類のレーザ光 λ 1 , λ 2 を使用する場合には、短い波長 λ 1 によって周期 1 の上限を限定し、長い波長 λ 2 によって周期 1 の下限を限定することが可能になるので、単一の偏光分離素子に対して波長の異なる2種類のレーザ光 λ 1 , λ 1 を入射する場合にも、所定角度として2 次以上の高次回折角を有する高次回析光を外部へ出射させない偏光分離素子を実現することができる。

【0116】請求項5記載の発明によれば、請求項1、2、3または4記載の偏光分離素子において、前記光学的異方性膜は、前記光学的等方性基板表面に斜め蒸着により蒸着された無機材料によって成膜されているため、光学的等方性基板表面に斜め蒸着によって無機材料を蒸着することで、光学的な異方性を有する単結晶を採用する場合と比較して、実用上、容易かつ安価に、光学的異方性膜を形成することができる。

【0117】請求項6記載の発明によれば、請求項1、2、3または4記載の偏光分離素子において、前記光学的異方性膜は、使用波長以下の周期構造を有するため、膜内に使用波長以下の周期構造を持つことで、光学的異方性膜全体に光学的異方性を持たせることができ、光学的な異方性を有する単結晶を採用する場合と比較して、実用上、容易かつ安価に、光学的異方性膜を形成することができる。

【0118】請求項7記載の発明によれば、請求項1、2、3または4記載の偏光分離素子において、前記光学的異方性膜は延伸された有機材料によって形成されているため、光学的な異方性を有する単結晶を採用する場合と比較して、実用上、容易かつ安価に、光学的異方性膜を形成することができる。

【0119】請求項8記載の発明によれば、請求項1な

いし7のいずれか一記載の偏光分離素子において、前記 光学的等方性基板は、研磨によって形成された研磨面よ り光を入出射するため、光を入出射する面に対してコー ティング等の処理を行う場合と比較して、実用上、実用 上、容易かつ安価に、光学的等方性基板を得ることがで きる。

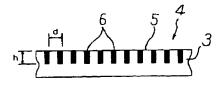
【0120】請求項9記載の発明によれば、請求項1ないし8のいずれか一記載の偏光分離素子において、前記光学的異方性膜に積層された2/4板を具備するため、例えば、光ピックアップ装置へ適用する場合に、部品点 10数の削減を図ることができる。

【0121】請求項10記載の発明によれば、請求項1ないし9のいずれか一記載の偏光分離素子において、光量をモニタするためのモニタ用受光素子へ向けて半導体レーザから入射された入射光を集光するモニタ光生成機構を具備するため、光源から出射された光をモニタ用受光素子へ向けて導くことにより、モニタ用受光素子でモニタされる光量が出射された光の波長に依存することがないので、APC駆動等の、モニタ用受光素子に導かれた光の光量に応じて行う光量安定化のための動作の信頼20性の向上を図ることができる。

【0122】請求項11記載の発明の半導体レーザユニットによれば、実装基板上に実装されてレーザ光を出射する半導体レーザと、前記半導体レーザから出射されたレーザ光が入射される請求項1ないし9のいずれか一記載の偏光分離素子と、前記実装基板上で前記偏光素子からの回析光が照射される位置に実装された受光素子と、を具備するため、半導体レーザの出力安定化を図ることができる。

【0123】請求項12記載の発明の半導体レーザユニ 30 ットによれば、実装基板上に実装されてレーザ光を出射する半導体レーザと、前記半導体レーザから出射されたレーザ光が入射される請求項10記載の偏光分離素子と、前記実装基板上で前記偏光素子からの回析光が照射される位置に実装された受光素子と、前記実装基板上で前記偏光分離素子のモニタ光生成機構からのモニタ光が照射される位置に実装されたモニタ用受光素子と、を具備するため、半導体レーザの出力安定化を図るとともに、半導体レーザユニットの小型化を図ることができ

【図2】



る。

【0124】請求項13記載の発明の光ピックアップ装置によれば、請求項11または12記載の半導体ユニットと、前記半導体レーザユニットから出射されたレーザ光を光記録媒体に照射する対物レンズと、前記半導体レーザユニット中の偏光分離素子と前記光記録媒体との間の光路上でレーザ光の偏光面を変換させる1/4板と、を具備するため、安定したレーザ光を得るとともに、モニタのために光記録媒体に対するレーザ光の光量の低下防止を図ることが可能になるので、安定した記録または再生動作を行わせることができる。

18

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1の実施の形態の偏光分離素子を示す側面図である。

【図2】Ta2O5膜を拡大して示す側面図である。

【図3】光ピックアップ装置の構成の一部を示す説明図 である。

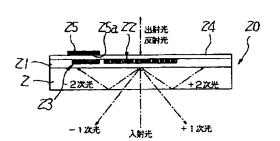
【図4】本発明の第2の実施の形態の偏光分離素子を示す側面図である。

【図5】光ピックアップ装置の構成の一部を示す説明図である。

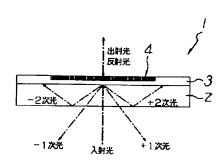
【符号の説明】

- 1 偏光分離素子
- 2 等方性膜
- 3 異方性膜
- 4 回析格子
- 5 第1の周期構造部
- 6 第2の周期構造部
- 10 光ピックアップ装置
- 11 半導体レーザ
- 20 偏光分離素子
- 21 異方性膜
- 22 回析格子
- 24 λ/4板
- 26 モニタ光生成機構
- 30 光ピックアップ装置
- 31 半導体レーザ
- L 半導体レーザユニット
- L' 半導体レーザユニット

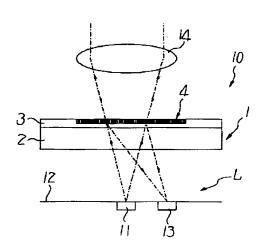
[図4]



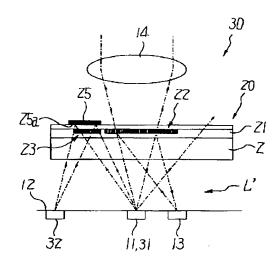
【図1】



【図3】



【図5】



フロントページの続き

F ターム(参考) 2H049 AA03 AA13 AA37 AA45 AA57 AA64 BA05 BA25 BA42 BB44 BC12 BC21 5D119 AA04 AA20 AA38 AA40 CA10 FA05 FA25 JA12